

1. Record Nr.	UNINA9910138789503321
Titolo	2009 International Test Conference
Pubbl/distr/stampa	[Place of publication not identified], : IEEE, 2009
ISBN	9781509069330 150906933X 9781424448678 1424448670
Descrizione fisica	1 online resource : illustrations
Disciplina	621.381548
Soggetti	Integrated circuits - Testing Semiconductors - Testing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph